

KS B ISO 15227

KSKSKSKS
SKSKSKS
KSKSKS
SKSKS
KSKS
SKS
KS

KS

광학 및 광학적 기기 - 현미경 -
스테레오 현미경의 시험

KS B ISO 15227 : 2003

(2008 확인)

지식경제부 기술 표준원

2003년 7월 23일 제정

<http://www.kats.go.kr>

심 의 : 정밀기계기술심의회

	성 명	근 무 처	직	위
(회 장)	민 수 홍	인하대학교	명 예 교	수
(위 원)	박 승 옥	대진대학교 물리학과	교	수
	성 아 영	대불대학교	조 교	수
	이 건 복	숭실대학교 기계공학과	교	수
	이 상 준	광산업진흥회	팀	장
	이 종 웅	청주대학교	교	수
	이 종 원	중앙대학교 기계공학부	교	수
(당 연 직)		시계공업협동조합	관 리 이	사
		한국광학기기협회	과	장
(간 사)	안 지 현	기술표준원 기계건설표준과		

표준열람 : 국가표준종합정보센터 (<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 지식경제부 기술표준원 제 정 : 2003년 7월 23일
 확 인 : 2008년 6월 23일 기술표준원 고시 제 2008- 0288 호
 심 의 : 산업표준심의회 정밀기계기술심의회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 지식경제부 기술표준원 기계건설표준과 (김익수 과장 ☎ 503-7946)으로 연락하시거나 웹사이트를 이용하여 주십시오. (<http://www.kats.go.kr>)

이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 5 년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다

**광학 및 광학적 기기 – 현미경 –
스테레오 현미경의 시험**

15227 : 2003
(2008 확인)

Optics and optical instruments – Microscopes – Testing of stereomicroscopes

서 문 이 규격은 2000년에 제1판으로 발행된 **ISO 15227**, Optics and optical instruments – Microscopes – Testing of stereomicroscopes를 번역하여 기술적 내용 및 규격서의 서식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

1. 적용 범위 이 규격은 스테레오 현미경에 대한 최소한의 요구 사항을 확인하기 위한 시험 조건과 추천된 시험 방법을 설명한다. 이 최소 요구 사항은 **ISO 10936-1**, **ISO 11884-1** 및 **ISO 11884-2**에 설명되어 있다.

이 규격에 설명된 방법은 바람직한 방법으로 추천되었지만 동일한 결과를 얻을 수 있는 다른 시험 방법도 허용된다.

2. 인용 규격 다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 날짜가 있는 인용 규격의 수정이나 교정은 이 출판물에 적용되지 않았으나, 이 규격에 관한 관계자의 동의를 거쳐 다음 서류의 최신판의 적용 여부를 조사하도록 중용할 수 있다. 날짜가 없는 인용 규격은 최신판을 적용한다. **IEC**와 **ISO** 회원은 현재 유효한 국제 표준을 등록 유지하도록 한다.

ISO 10934-1 광학 및 광학적 기기 – 현미경에 대한 어휘 – 제1부 : 광학 현미경

ISO/CIE 10526 색도계에 대한 CIE 표준 광원

3. 정 의 이 규격에 대한 정의는 **ISO 10934-1**에 있는 용어와 정의를 적용한다.

4. 시험의 정확성 시험은 결정될 값의 10%보다 더 정확하게 수행되어야 한다. 측정에는 통계에 의한 평가의 일반적인 규칙에 따라 수행한다.

비 고 측정 방법 및 통계에 의한 평가에 기초한 결과의 정확도는 **ISO 5725** 시리즈에 설명되어 있다.

5. 시험 조건

5.1 전체 가시 배율($M_{TOT\ VIS}$) 수직 중심선에서 최고 배율(M_{max})과 최소 배율(M_{min})의 전체 가시 배율을 측정한다.

5.2 좌·우 광학 시스템에서 전체 가시 배율의 차이 수직 중심선에서 최고 배율(M_{max})과 최소 배율(M_{min})의 차이를 측정한다.

5.3 좌·우 광학 시스템에서 축의 차이 각각 65 mm IPD에서 최고 배율(M_{max})과 최소 배율(M_{min})의 최대 차이를 측정한다.

5.4 좌·우 광학 시스템에서 이미지 영역의 중심의 차이 각각 65 mm IPD에서 최고 배율(M_{max})과 최소 배율(M_{min})의 차이를 측정한다.

5.5 좌·우 광학 시스템에서 이미지 회전의 차이 IPD 55 mm와 75 mm에서 이미지 회전의 차이를 측정한다.